PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63018529 A

(43) Date of publication of application: 26.01.88

(51) Int. CI

G11B 7/09 G11B 7/085

(21) Application number: 61161837

(22) Date of filing: 11.07.86

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(72) Inventor:

OTAKE MASATOSHI YONEZAWA SEIJI TSUKI TOSHIAKI TAKASUGI KAZUO TAKEUCHI TAKASHI

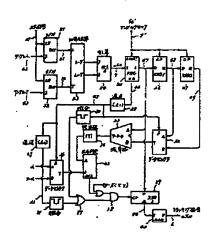
(54) OPTICAL DISK TRACKING SYSTEM

(57) Abstract:

PURPOSE: To avoid a large acceleration from being given to a tracking actuator even if an erroneous sample takes place by disusing a newest sample if variation exceeds an allowable value through the comparison between the newest sample and the past sample.

CONSTITUTION: A differentiation circuit 30 pulsizes a level change point from '0' to '1' level at an output 45 of a 1st delay circuit and when the level reaches an AND circuit 38, the newest sample data are latched in a hold data output register 39 and an output DA converter 40 gives a tracking error hold signal 6. While the 1st delay circuit output 45 restores to '1' level and the output of a 2nd delay circuit is at '0' level, it is a period of comparison with next preceding sample data, a sample data select 32 selects the next preceding data. executes the difference operation with the newest data, applies decision of quantity with a value twice the allowable sample variation α , and when it is within the allowable range, the period end timing is pulsized and the newest data latches to a hold data output register 39.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio



⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 18529

@Int_Cl.4

識別記号

- 庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988) 1 月26日

G 11 B 7/09 7/085 C-7247-5D H-7247-5D.

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 7頁)

9発明の名称 光ディスクトラッキング方式

②特 顋 昭61-161837

❷出 願 昭61(1986)7月11日

砂発 明 者 大 竹 正 利 東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内

砂発 明 者 米 澤 成 二 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

砂発 明 者 津 器 敏 明 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内

⑦発 明 者 高 杉 和 夫 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内

①出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

②代理人 并理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

明 、 知 、 音

1. 発明の名称 . .

光ディスクトラッキング方式 :

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 回転記録媒体の回転方式に沿って、同心円ま たはスパイラル状に形成されたトラック上を、 トラッキング、鉄笠、信号検出領域と、プリピット データ領域または追記データ領域とが交互に形 成された光ディスクを用い、該トラッキング製 差信号検出領域 (サーボ領域) で得られるトラ ッキング誤差信号をサンプル&ホールドするこ とによって、トラック追跡動作(トラッキング 動作)を行なわしめる方式において、最新のは サンプル値を1回前、2回前等過去のサンプル と気と比較せしめることにより、該最新サンプ ル低が正常であるか異常であるかを判定し、も し異常であると判定せしめたときには、現在の トラッキング誤差信号ホールド値を更新するこ となく、即ち、トラッキング製差信号の最新サ ンプル鼠を用いずに、ホールドされている前回

までのトラッキング製差信号の虫まで、トラッキング・サーボ信号とすることを特徴とする光 ディスクトラッキング方式。

- 3. 上記トラッキング誤差信号検出領域(サーボ 領域)におけるトラッキング誤差信号のサンプ ル値が異常(思サンプル)であると利定したと き、過去のサンプル値ならびにトラッキングア クチュエータ部に取り付けた加速度検出器の値 から、正常なサンプル値を予測し、異常を値を 示している最新サンプル値を入れ替え、ホール

ド出力信号とすることを特徴とする特許語 水範 囲第1項記載の光ディスクトラッキング方式。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本晃明は、コードデータ光ディスクメモリ装置のトラッキング方式に低り、特に、大量生産に適したサンプリングサーボ方式光ディスク装置に好適なトラッキング方式に関する。

〔従来の技術〕

従来のサンプルトラッキング方式の光ディスク 装置には、高周波サンプル方式と、低周波サンプ ル方式があり、サーボ領域に予め配置されている トラッキング情報をサンプル&ホールドすること によってなされていた。しかし、誤サンプルによ るトラックずれに対する配慮がなされていなかっ た。

[発明が解決しようとする問題点]

上記従来技術は、ディスク表面の傷、汚れ、または電気的ノイズ等に起因する異常な館のサンプル (誤サンプル) に関する配慮がされておらず、

このように誤サンプルによって、トラッキング用アクチュエータに加えられる加速度Aは、このホールド時間をTとすると次式のようになる。

$$A = \frac{2 \cdot \Delta e}{T^2} \quad (m / sec^2)$$

本発明の目的は、前述したような要因による サンプルが発生したとしても、トラッキング用ア クチュエータに大きな加速度を生じせしめないよ うにすることにある。

〔同選点を解決するための手段〕

上記目的は、最新のサンプル値を過去のサンプル値と比較し、許容されるバラツキ以内であるか否かを判定し、もし許容値を超えているときには、 最新サンプル値を用いないようにすることにより、 速成される。

〔作用〕

トラッキング試差倡号の最新サンプル値が、 そのサーボ系に許された外乱加速度などをかんがみ た結果、許容値以内のパラツキであるかどうかを 試サンプル値を1サンプル期間だけホールドした場合においても、トラッキング用アクチュエータに大きな加速度が印加されたことに等価となり、 光スポットはトラック中心を長時間外れた状態となってしまう問題があった。

判定し、その判定結果にもとずき、ホールド出力 値に何を用いるかを判定する回路は、トラッキン グサーボループに無駄な外乱要素が加えられない ように動作する。それによって、トラッキング用 アクチュエータには、誤サンプルに起因するカ (加速度)が加えられることがなくなるので、光 スポットは常にトラック中心を追路することが可 館となる。

〔実質例〕

以下、本発明の第1の突旋例を第1回、第3回、第4回、第5回を用いて説明する。第1回はプロック線回(a)ならびにそのタイムチャート(b)を示す。トラック道跡目標系と、スポット軌跡(トラッキング用アクチュエータ位置)との登分、即ちトラッキング談差信号 Δ X を、サンプルストリーション ストラッキングの第1 ー 1 でサンプルストリーン がいまる ひとり はな サンプル はな サンプル はな サンプル 位 ム X * をホールド回路1 ー 2 に む し、位相補信 四路 2 、アンブル回路 3 、トラッキング用アクチ

特開昭63-18529(3)

ュエータ4を駆動し、光スポット X z を移動し、 Δ X が小さくなる方向に一選系が構成される。 こ こで、仮にタイムチャートに示すような数サンプ ルが発生しサンプル出力信号 7 に Δ o のようなイ ンパルス成分が出現したとき、ホールド出力信号 6 には、破譲で補完したような出力信号となるようにし、サンプルパルス 5 の次のサンプルタイミ ングによって正しい値をサンプルとするまで、

 Δ X x の値は更新されないように構成する。この調サンプルによってアクチュエータに生ずる加速度は、前にも述べたように加速度 A = 2 · Δ e / T^3 (m / s e c^3) であるから、仮に 0 · 1 μ m 相当の割サンプル値を 3 3 μ s の期間出力したとすると、 2 0 0 (m / s e c^3) \Rightarrow 2 0 · G という大きな力がトラッキングアクチュエータに印加されたのと等価になり、該アクチュエータは大きく扱られてしまう。

第3回は、用いた光ディスクの構成図を示す。 トラック10の1個は、N個(今回は1,024) なり のサーボセクタ13が算分割に配置され、そのサ

ーポセクタ内はサンプリングサーポ領域(トラッ キング誤差信号検出領域) 111とデータ領域12 とに分割されている。また、サーボ領域11にお けるトラッキング情報は、チドリ状にプリピット したプリウォプリング法(例えば、特配昭60~ 93618) によって得る方式とした。第4回は、 ブロック墓図(第1図)のサンプル&ホールド區 路1と判定回路8をディジタル方式で具体化した プロック構成図である。なお、プリウォブリシグ 法によるトラッキング誤差検出方式としたため、 第1回におけるサンプルパルス!。は、第4回の 構成においては、第1ウォブルピット信号のサン プルタイミング(サンプルL42)と第2ウォブ ルピット信号のサンプルタイミング(サンプルT 4 3)ならびに、プリウォリングマークの包集箱 果出力 (fa': サンプルクロック5') の3つの 信号によって構成される。なお、第5箇は、第4 図の各部放形を示すものであり、以下、第5図を 参照しながら氪4回を説明する。

5 サーポ領域ならびにデータ領域(第4図ー a)

部から得られる光スポットの反射線光量を示す RF信号41のサーボ領域部分には、プリウォブ リングピットによるトラッキング伏役が含まれて いる(第5回-b)。第1のウォブルピットサン プルタイミング信号サンプルL42(第5回一c) は、第1のウォブルピットの信号波高値をサンプ ルをホール回路21にホールドし(第5回-m)。 第2のウォブルピットサンプルタンミング信号サ ンプルT43(第5回一d)は、サンブルをホー ルド回路22へ、第2のウォブルピット部の信号 波路値をホールドし(第5回ーュ)、それぞれの 出力51と52は加算/波算器23によって加減 算し、割算器24を経て、トラッキング試差信号 はサンプル出力 A Xa(第5回 - o) となり、AD コンパータ25へ入力する。プリウォブルマーク 認識結果出力!』、即ち、サンプルクロック5!

(第5回一 e) によって、該ADコンパータは起動され、△スェの量子化終了を知らせるコンパージョンエンド信号44(第5回一1)を、第1の選延回路28によっても、時間だけ遅延させた信

号45(第5回一g)、さらに ta時間遅延させ た信号46(第5回ート)を得るための第2の遅 延回路29に入力する。ここで、サンプルクロッ ク5′は、前回データレジスタ26ならびに前々 回データレジスタ27のラッチ信号としても用い られ、コンパーションエンド信号44の出力直接: においては、ADコンパータの出力は最新のトラ ッキング講差サンプルデータ47(第5回ーi)、 前周データレジスタ26の出力には前層のトラッ キング獣差サンプルデータ48(餌5回ー5)、 前々回データレジスタ27には前々目、耶ち2回 錠のトラッキング緊急サンプルデータ49(第5 図ーk)が、それぞれ記憶された状態となってい る。第1の遅延回路出力45が"0"レベルとな っている題間は、前回サンプルデータとの比較を 行なっている期間であり、該期間はデータセレク タ32は前回サンプルデータを選択しており、減 算回路33によって最新サンプルデータ47との 差を演算し、絶体値回路34によって絶体値化し、 大小判定回路35へ入力する。大小判定回路35

の一方の入力は、単位サンプル毎に許容されるサ ンプルパラツキ量(許容談サンプル豊または外部 から印加される加速度の許容値を換算した値) α がデータセレクタ36で選択されており、絶体値 回路の出力、即ち最新サンプル値と前回サンプル. 値との差分の絶体値が、ロより小さいときには該 大小判定回路のA<Bが"1"レベルとなり、前 回サンプルデータとの比較期間終了時、即ち、第 1 の遅延回路出力 4 5 が " 0 " レベルから " 1 " レベルに変化する点を微分回路30によってパル ス化し、論理和回路37を経て、論理積回路38 に達したとき、該論理積回路は通過状態となり、 ホールドデータ出力用レジスタ39には、最新サ ンプルデータがラッチされ(第5図ー1)、出力 用DAコンパータ40によってトラッキング誤差 ホールド信号6(第5回~p、AXu)となる。 また、第1の遅延回路出力45が"1"レベルに 戻り、第2の遅延回路が **"0"**レベルの期間は、 前々回サンプルデータとの比較期間であり、サン ブルデータセレクト32は前々回データを選択し、

誘差ホールド出力となる。

第6回は、本発明の第2の実施例を示す図であ り、第4で示す第1の実施例との相異は、前回サ ンプルデータ48ならびに前々回サンブルデータ 49を項算し、予測される最新サンプルデータを 出力するテーブル54ならびに、前回データとの 判定期間(遅延回路28が "0" レベルとなって いる期間)において、サンプルパラツキがαを超 えているときに"1"レベルとなる論理積回路 53が追加されているだけである。即ち、論理積 回路53が『0』レベルを出力している状態(± a 以内にバラツキが納まっている)では、最新サ ンプルデータをそのまま出力し、ホールドデータ 出力用レジスタに入力しており、第4回の動作と 全く同じとなるが、論理俄回路53が"1"レベ ル(±αの範囲を超えている状態)となったとき には、予選データを出力し、第2の遅延回路29 の出力が * 0 * から * 1 * へ戻るタイミングでそ の値をホールドデータ出力用レジスタにラッチす る.

最新データとの差分浪算を実行し、許容サンプル パラツキαの2倍の餌(αデータセレクタ36で **通択)との大小判定を行ない、その範囲内であれ** ば該期間終了タイミングを微分回路31でパルス 化し、前記、前回データ比較期間終了時と同様に、 ホールドデータ出力用レジスタ39へ最新データ をラッチする。 皿ち、1サンプル期間内であれば α、 2 サンプル期間内で比較する際には 2 倍の α に恋を広げ、その範囲内であれば、ホールド出力 を更新し、その範囲を超えていれば前回データの ままでトラッキングを行うことになる。このこと は、例えば第5図ー(m) において、破線51′ で示すような誤サンプル#1ウォブルピット部分 で発生したとすると、同図-(o)の破線部分? で示すようなAXsとなり、その飯が前回サンプ ル値との比較でαを超えており、かつ、前々回サ ンプル値との比較においても2・αを超えていた カ用レジスタの値はそのままの状態が保持され、 同図-(p) の破線で示す波形6′がトラッキング

本実施例によれば、トラッキング製造サンプル値のバラツキが、予め設定した範囲から外れたとき、オリウォブリングマークが見出ないでは、ホールド出力が更知される予盟やかったときには、ホールド出力が関われる予盟をある。と称なくなり、サングリングサーボ方式のトラッキングの特度向上に効果がある。

〔発明の効果〕

本発明によれば、トラッキング製券のサンプル 値が、許容値以上にバラついてサンプルしたこと に起因する、トラッキング用アクチュエータに加 わる不測のカ (加速度)を事前に防止することが でき、サンプリングサーボ方式トラッキングの程、 度向上ならびに信頼性向上の効果がある。

4. 図面の簡単な説明

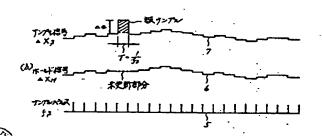
第1回は本発明の一実施例のプロック模図とその波形図、第2回はサンプリングサーボ方式トラ

特開昭63-18529(5)

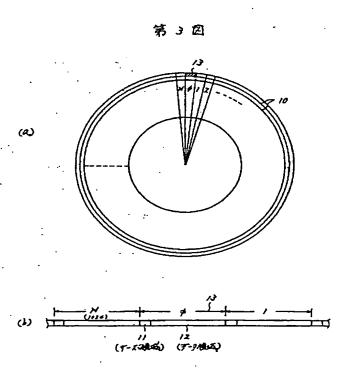
ッキング法の一般的構成を示すブロック線図とその波形図、第3回は実施例で使用したディスクの 構成図、第4回は第1の実施例を示す回路ブロック構成図、第5回は第4回の各部波形図、第6回 は本発明の第2の実施例を示す回路ブロック図である。

1 … … サンプルをホールド回路、 4 … … アクチュエータ、 5 … … サンブルパルス、 6 … … トラッキング製造ホールド出力、 7 … … トラッキング製造サンプル出力、 1 1 … … サーボ領域、 1 2 … … データ 領域、 1 3 … … サーボセクタ、 4 1 … … RF信号、 4 2 … … サーブルパルス、 4 3 … … # 2 サンプルパルス、 2 3 … … 加減算器、 2 5 … … A Dコンパータ、 2 6 … … 前回データレジスタ、 2 7 … … 前々回データレジスタ、 3 3 … … 減算回路、 3 5 … … 大小判定回路、 3 9 … … ホールドデータ 出力用レジスタ、 4 0 … … D A コンパータ、 5 4 … … 予期テータブル。

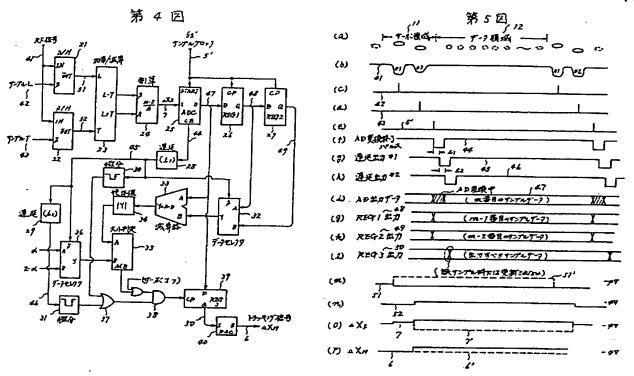
第1四

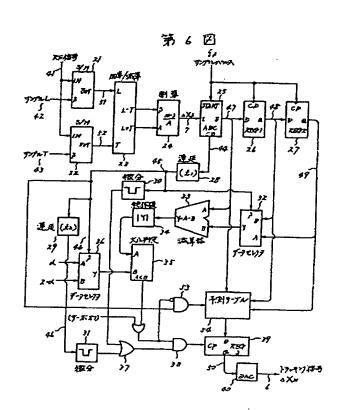


代理人 弁理士 小川路男



特開昭63-18529(6)





特開昭63-18529(7)

第1頁の続き

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 砂発 明 者 内